


NO.	5	
機器名	電子顕微鏡 日本電子製 JSM-6610LA	
取得	平成21年7月17日	
使用料	900円/時間 7,200円/日	
概要	測定物の電子レンズでの拡大観察、元素分析など。	
特徴	物質の表面観察、さらに非破壊で元素分析を簡単にできる。	
用途	半導体・電子部品などの表面の異物調査、各種原材料の元素分析。	
主な仕様	SEM仕様 1. 倍率 5~30万倍 2. 加速電圧 0.3~30kV 3. 検出系 2次電子及び反射電子検出器 試料ステージ 大型ユーセントリック形 X : 125mm、Y : 100mm、Z : 5mm~80mm 傾斜 : -10° ~ +90°、回転 : 360°	EDS仕様 1. 検出可能元素 Be~U 2. 定性・定量分析
利用業種	電子部品・メッキ工業、車関係、金型関連、大学等の開発研究など多岐にわたる。	
	【主に測定されるもの】 各種部品上の汚れ・欠陥等の観察・元素分析。	
	【テクノコーディネータから一言】 試料の写真撮影をし、それを基に観察・分析するため、大量の試料でも短時間で測定可能。 また、機器操作、測定方法、評価方法について随時 無料講習会を行っております。日時 につきましては、ご相談ください。	
	測定機器写真 	測定の様子 